



製造元：株式会社右近工舎
販売元：株式会社東京インスツルメンツ

蛍光寿命測定装置 FLT-100

日立F7000試料室に設置！

特長

Point 1 »»

既設の蛍光分光光度計に装着、
静的な蛍光分光特性と動的な蛍
光寿命が同一のサンプルで測定
できます。

Point 2 »»

蛍光スペクトルと寿命は独立して
測定でき、お互いに干渉すること
はありません。

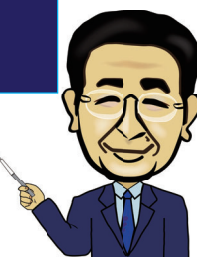
Point 3 »»

蛍光寿命は光子計数方式で明るい
光学系なので、微弱蛍光でも測定
できます。

仕様

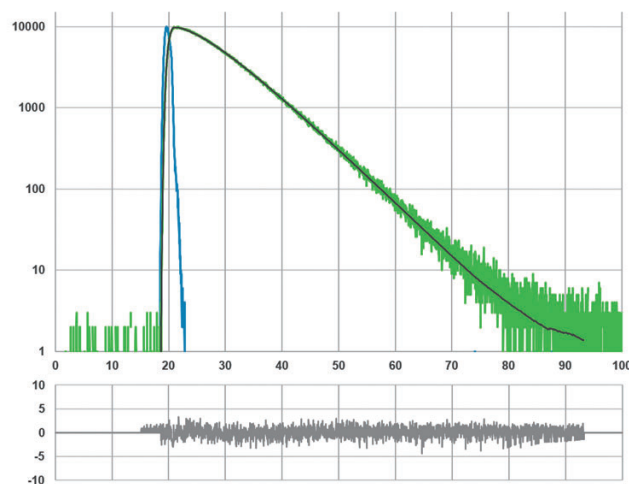
型名	FLT-100
測定範囲	1ナノ秒～150ナノ秒
時間分解能	100ピコ秒以下
励起光源	488 nm (他選択可能：375、405、540 nm) LD、短い励起光幅、パルス幅：130ピコ秒以下
検出器	光電子増倍管 (400～750 nm) マルチアルカリ光電子増倍管 (オプション：GaAsP光電子増倍管)
測定ユニット	同軸照射受光プロープ式
フィルター	励起光：480/20 nm バンドパスフィルター ダイクロイックミラー：カットオン 505 nm 蛍光：540 nm ロングパスフィルター ※上記は488nm光源向け、フィルター組合せは変更可能
接続	マルチモード光ファイバー
制御ユニット	励起光源、検出器、プリアンプ、カウンター、制御回路
波高弁別器	コンスタント フラクション ディスクリミネータ (CFD)
カウンター	250 MHz

株式会社 右近工舎
代表：右近 寿一郎氏

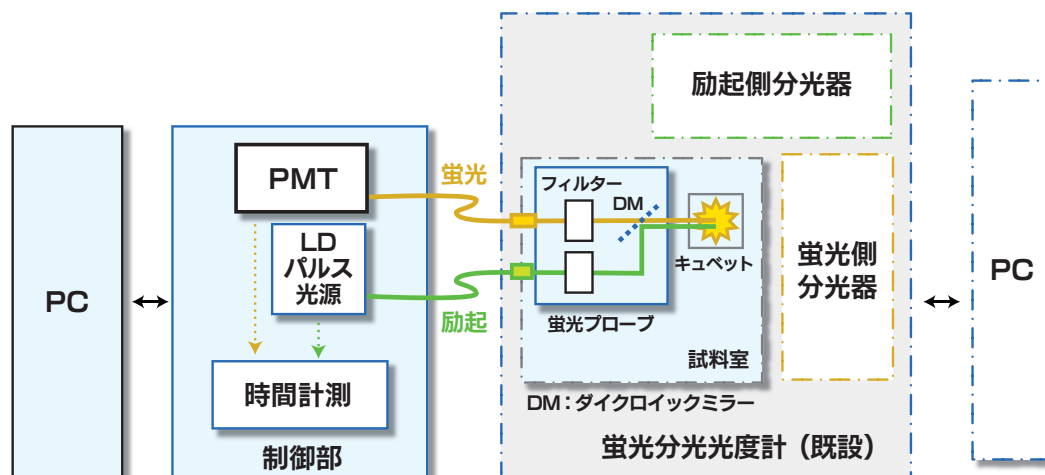


測定例

蛍光アクリル板 | 励起光：488 nm
受光フィルター：540 LPF

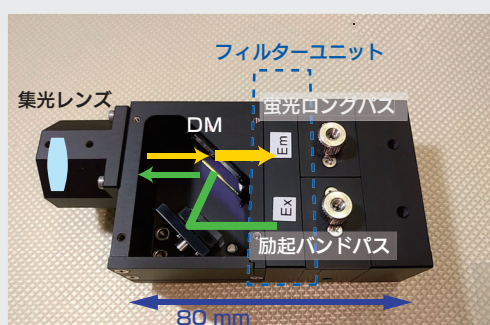


装置構成



LD 光源の発光パルスと蛍光の一光子パルスの時間間隔を繰り返し測定しそれを積算し、ヒストグラム、蛍光減衰カーブが形成されます。蛍光寿命は、測定カーブに指数関数をフィッティングして求められます。

装置部外観



▲ 測定プローブの構造



▲ 蛍光寿命ユニットとして
試料チャンバー（オプション）を付属して
専用機として使用できる



◀ 日立 F7000 試料室に設置
京都府中小企業技術センター
光ファイバー未接続

TII 東京インスツルメンツ
TOKYO INSTRUMENTS

グローバルにネットワークを広げ、最先端の科学をお客様に提供

本 社：〒134-0088 東京都江戸川区西葛西6-18-14 T.I.ビル Tel. 03-3686-4711

営業所：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-1-46 新大阪北ビル Tel. 06-6393-7411

URL: <https://www.tokyoinst.co.jp> Mail: sales@tokyoinst.co.jp

TII Group Company

UNISOKU
TII Group

超高真空・極低温走査型プローブ顕微鏡
高速分光測定装置、クライオスタット

LOTIS TII

Nd:YAGレーザー、Ti:Sレーザー
OPOレーザー

- 本カタログに記載されている内容は、改良のため予告無く変更する場合があります。（製品の仕様、性能、価格などはカタログ発行当時のものです）
- 本カタログに記載されている内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- 本カタログに記載されているメーカー名、製品名などは各社の商標または登録商標です。